

增刊

e/n识别的dE/dx方法在北京谱仪 τ 重轻子质量测量中的应用

荣刚,马基茂,毛慧顺,王泰杰,白景芝,李卫国

中国科学院高能物理研究所 北京 100039

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文介绍了北京谱仪(BES)主漂移室(MDC)e/n识别的dE/dx方法在 τ 重轻子质量测量中的应用.该方法的应用使得对 $\tau^+\tau^-$ 衰变产生的“ $e\mu$ ”事例的标记效率,比仅用传统的电磁簇射信息标记时提高了3倍以上.效率的提高不仅减少了事例丢失,还使得为找到同样多的 $\tau^+\tau^-$ 事例所需要的谱仪和对撞机运行时间和数据离线处理所用的计算机CPU时间均减少了~75%.

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

荣刚

作者个人主页: 荣刚;马基茂;毛慧顺;王泰杰;白景芝;李卫国

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(256KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [荣刚](#)

· [马基茂](#)

· [毛慧顺](#)

· [王泰杰](#)

· [白景芝](#)

· [李卫国](#)